

## **DETERMINACION DE CONSTANTES OPTICAS DE FILMS DELGADOS MEDIANTE ELIPSOMETRIA**

**Carrera que se vincula:** Licenciatura en Física

**Período:** 2011

**Becario:** Comisso, Antonella

**Director:** Gómez, Bernardo José

**Integrantes:** Gómez, Bernardo José

**E-mail:** antocomisso@gmail.com

**E-mail:** bernardo@fceia.unr.edu.ar

### **Objetivos**

Generales:

Adaptación y calibración de un sistema de adquisición de las componentes de polarización de un elipsómetro para la calibración de las propiedades ópticas de films delgados.

Específicos:

- Generación films de escala nanoscópica mediante la técnica de la deposición física en fase vapor asistida por plasmas (PAPVD).
- Determinación de las propiedades ópticas por elipsometría y estructural por difracción de rayos X rasantes (GXRD) de los films obtenidos.
- Estudio de correlación entre los parámetros de la descarga con la generación de films con propiedades ópticas de interés científico-tecnológico.

**Disciplinas:** Física

**Especialidad:** Materiales

**Palabras Clave:** generación de films - propiedades ópticas - elipsometría